(citation 1)

Japanese Utility Model Laying-Open Publication No. \$59-149,070

Publication Date: October 5, 1984

Application No. S58-42,853 filed March 25, 1983

Inventor: Kamiteru MIZUNO

Applicant: NEC K.K.

Title of the device: Apparatus for testing wiring on printed circuit board.

(Claim)

An apparatus for testing wiring on a printed circuit board comprising a support substrate (8) of a dielectric material on which an array of probes (5) are arranged to stand at the intersections of a predetermined imaginary grid, a printed circuit board (6) having a land (1a) registered with one of said intersections of said imaginary grid and a land (2) not registered with any of said intersections and an interposer (7) having a through hole (4) at a position (1a) facing the land (1a) registered with said intersection of said imaginary grid, said interposer is provided with a conductive pattern (3) for making contact with the land (2) not registered with said intersections of said imaginary grid and said conductive pattern (3) is connected (3b) to a through hole land (3a) which makes contact with one of said probes, characterized in that said conductive pattern (3) for making contact with the land (2) not registered with said intersections of said imaginary grid has a surface that is raised to project from the neighboring area.

(Abridgment of the description)

The claimed apparatus is directed to a interposer 7 used for testing a printed circuit board 6. The interposer 7 is disposed between the printed circuit board 6 and a probe array substrate 8, and is provided with a through hole 4 registered with a circuit node 1a to be tested and a probe 5. For a circuit node 1b not to be tested, no through hole is provided. For a circuit node 2 to be tested but not registered with a probe 5, a contact 3 is provided to face the node 2 and is connected via a conductive link 3b to a land through hole 3a that is registered with the probe 5. The contact 3 is projected upwardly from the interposer 7 to achieve good contact.

(Description of Fig. 5)

"Figs. 5(a) and 5(b) are enlarged partial sectional and perspective views, respectively, of another embodiment of the present device, in which a conductive rubber is disposed at a position where the interposer contact 3 needs dampening. In this embodiment, the elasticity of the rubber performs cushioning. The conductive rubber may be affixed onto the interposer 7 by thermal forming after a liquid conductive rubber material is printed on a predetermined position by, for example, screen printing."

(!) A. vid

(9) 日本国特許庁 (JP)

①実用新案出顧公開

¹⁹ 公開実用新案公報 (U)

昭59-149070

5].Int. Cl.³ G 01 R 31/02 1/04

識別記号 庁

庁内整理番号 7807-2G 6637-2G

49公開 昭和59年(1984)10月5日

審查請求 未請求

(全

頁)

34印刷配線板の布線試験装置

類 昭58-42853

順 昭58(1983)3月25日

符考 案 者 水野上晃

21実

23出

東京都港区芝五丁目33番1号日

本電気株式会社内

乔出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

沙代 理 人 弁理士 内原晋

考案の名称 印刷配線板の布線試験装置

2 実用新案登録請求の範囲

一定の仮想格子の交点上に測定ピンを植立させた た絶縁板からなるピン支持板と、前記仮想格子の交点上に位置しない各ランドを有する の成点上で位置しない各ランドを有する のは、前記部板と、前記部板の仮想格子の交点上の被測定ランドに対向した位置 が大力がある。 が大力が、 が大力が大力が、 が大力が、 が大力が、 が大力が、 が

1 (

1!

は一番

公開実用 昭和59一 149070

3. 考案の詳細な説明

本考案は導体パターンのプリッジ、ショート等を検査する印刷配線板の布線試験装備に関し、特に一定格子の交点上に検査プロープを配置した汎用型布線試験機を使用する場合の布線試験装備に関する。

5

印刷配線板上の導体パターンの布線試験を行う手段としては、(イ)値々の印刷配線板に対し値別に設計される専用布線ペッドプロックを用いる場合と、(中)一定格子の交点上に検査プロープを配置した汎用布線ペッドを用いる場合に大別される。

10

しかし、前者の専用布線へッドを用いるものは、 検査の必要箇所は完全に検査ができる代りに、布 級ヘッド製作の工数がかかるため、大量生産品に のみ、適用が限られるという欠点があった。

15

一方、後者の汎用布線へッドを用いるものは、 布線へッド製作の工数が僅かで済むが、検査箇所 が一定の格子の交点上に限られ格子の交点上に位 値しない被検査ランドが多い印刷配線板について は、検査率が低下する欠点があった。そこですべ



ての印刷配線板について、高価を布線へッドを逐 一製作せずに、共用の検査へッドにより、検査必 要簡所のみを検査する従来手段が知られている。

第1図(a),(b)は前述従来手段の構成の説明図で ある。第1図(a)に示すように絶縁板上の一定格子 の交点上に検査プロープを突出して設備した布線 ヘッド8と被検査の印刷配線板6との間に、中継 板7を配置させている。次に印刷配線板6の仮想 格子の交点上に位置して設けたランドバターンの 中で、布線検査を必要とするランドスルホールla には直接布線ヘッド8の検査プロープ5が接触す るように中継板7の同位艦に貫通孔4を設け、か つ検査の不要な格子の交点上のランドスルホール 1bには、検査プロープ5が接触しないように、 貫追孔を設けない。次に印刷配級板6の仮想格子 の交点上に位置しないランドスルホール2につい ては、中継板1の中艦用ランドスルホール3aと 郊谷パターン3bにより振続して設けられた中継 用接触部3と接触させ、電気的導通をとり、中総 用接触部 3 と接続して設けた中継用ランドスルホ

5

10

15



ール 3 a を介して、検査プロープ 5 とのコンタク トを得ている。

5

このため、第1図(a)を断面図で示した第1図(b) に示すように印刷配線板 6 上に被磨したソルダーレジストコーティング層 9 の厚さにより、格子の交点上に位置しないランドスルホール 2 と中継板7の中継用接触部3間の電気的接続を安定して得ることが難かしかった。

10

本考案の目的は、かかる従来欠点を解決した印 刷配線板の布線試験装置を提供することにある。

15

本考案によれば一定の仮想格子の交点上に測定 ピンを根立させた絶縁板からなるピン支持板と、 仮想格子の交点上並びに交点上に位置しない各ラ ンドを有する印刷配線板と、印刷配線板の仮想格 子の交点上の被測定ランドに対向した位態に貫通 孔を設け、かつ印刷配線板の格子の交点上にない



被測定ランドに接触する導電パターンを測定ピンと接触するスルホールとで接続して設けた中継板により構成される布線試験装置において、上配仮想格子の交点上に位置しない被検査用ランドと接触する導電パターン表面を周辺より突設させたことを特徴とする印刷配線板布線検査装置が得られる。



上に中継用スルホール3 a と、この中継用スルホール3 a と中継用接触部3を電気的に接続する導体パターン3 b を設ける。このように構成した中継板7を第2図(b)の如く被検査の印刷配線板6と検査プロープ5を突設させた布線ヘッド9の中間位値へ挿入することにより、印刷配網板6上の検査に必要なランドすべての検査が可能となる。

5

次に本考案中総用接触部3の構造について従来例の第3図(a),(b)と本考案與施例の第4図、第5図の部分拡大図を参照して説明する。期3図(a),(b)は従来の中継板7を用いて被検査の印刷配線板6上の格子の交点上に位置しないスルホールランド2と検査プロープ5とを電気的に接続する。被検査の印刷配線板6上の中継用接触部3は、中継板7上の中継用スルホールランド3aと同じ高さであるため、印刷配線板6上のソルダーレジストコーティング展9の厚みが加わるため、被検査のスルホールランド2と中継接触部3は接触せず、従って

10

15

20



検査はできない。次に従来例と比較して本考察に

15

10

5

第5図(a),(b)は本考案の他の実施例を示す部分 拡大断面図および斜視図であり、中総接触部3に 緩衝を必要とする簡所に、導電性を有するゴムを 被漏させたものである。この実施例ではゴムのも つ弾性がクッションの役割を果す。なお、導電性



ゴムを中継板7上に被滑させる手段としては、液 状の導電性ゴムの原料をスクリーン印刷等で所定 の部分に印刷した後に加熱成形する。

また本実施例では、専制性を有するゴムを用いたが、他に導電性強料、導制性接触剂、もしくは 導電性インクを用いることもできる。

以上、本考案により、次の効果がある。

- (II) 高価な専用の個別ヘッドを製作する必要がないため、コスト的負担がなくなり、かつすべての印刷配額板の布線模型が出来るので、模査作業の標準化ができる。
- (III) 非格子上ラントを含めた印刷配線板上のすべてのラントを検査できる。
- (肌) 端子ブロックなして、端子部の核変ができる。
- 4. 図面の簡単な説明

第1図(a),(b)は従来の布額検査装置の主要部の 斜視図および断面図。

第2図(a),(b)は、本考案による布線試験装置の主要部の斜視図および断面図。

T. L.

- 8 -

5

10

第3図(a), (b)は、従来例の中継用接触部の断面図および斜視図。

第4図(a),(b)なよび第5図(a),(b)は本考案例の中継用接触部の断面図および斜視図。

1 a ……検査の必要な格子の交点上のランドスルホール、1 b ……検査の不要な格子の交点上のランドスルホール、2 ……検査の必要な格子の交点上にないランドスルホール、3 ……中継用景触部、3 a ……中継用スルホール、4 ……質消孔、5 ……検査ブローブ、6 ……印刷配線板、7 ……中継板、8 ……布線ヘッド、9 ……ソルダーレジストコーティング層。

代理人 弁理士 内 原

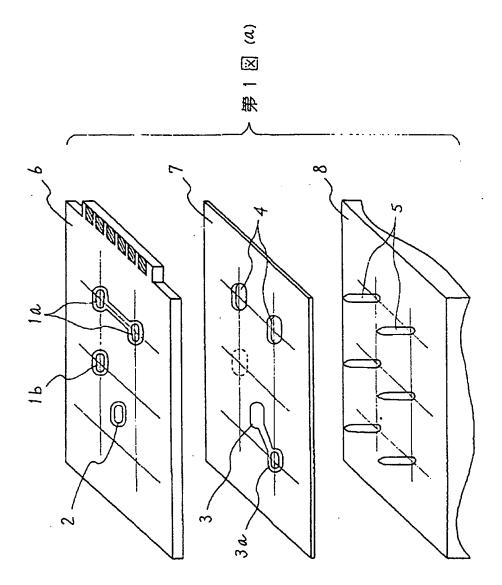


5



R型人分配士 四 原

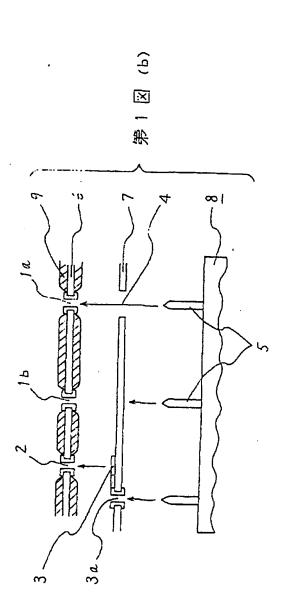
EİU



724

実開 59-149 67 ()

代型人·并是士 內 原



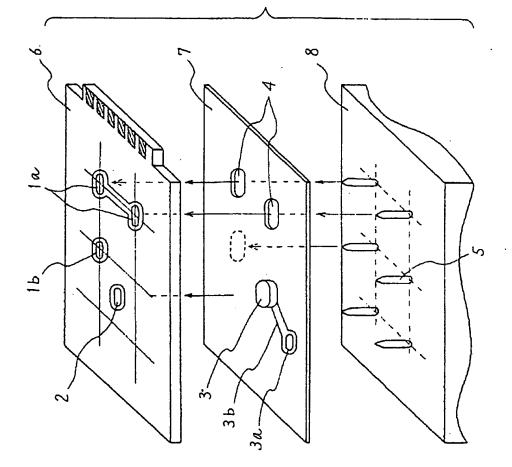


脚

迴

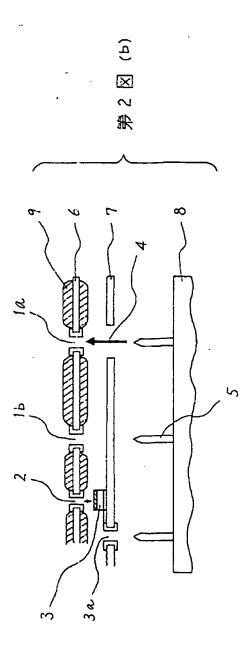
代表人名巴士 15

第2区(4)



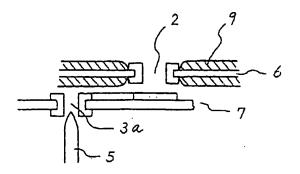
.726



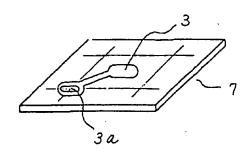


P. C.

公開実用 昭和59一 149070



第3図(a)



第3図(6)

第5图 (9)





